

术语

ADI

ARM 调试访问端口

Aligned

存储在地址中的数据项，该地址可以被定义其数据大小的字节数整除。对齐双字、字和半字的地址分别可以被8、4和2整除。一个对齐

访问是指访问的地址与访问的每个元素的大小保持一致。

Big-endian

在数据的上下文中，Big-endian被定义为内存组织一个字的有效字节的地址低字节数据存放在地址高位，例如：

- 字对齐地址处的字节或半字是该字中最重要的字节或半字地址。
- 半字对齐地址处的字节是该地址处的半字中最重要的字节。

参见Little-Endian和Endiannes。

Debugger

一种调试系统，包括一个程序，用于检测、定位和纠正软件故障支持软件调试的自定义硬件。

Doubleword

64位数据项。在Arm芯片中，双字通常至少与字对齐

Endiannes

在一个较大的数据结构中，当该结构存在时，确定连续数据字节顺序存储在内存中的方案。参见Little-Endian和Big-Endian。

Halfword

一个16位的数据项。半字在Arm系统中通常是半字对齐的

JTAG

一个IEEE小组专注于硅芯片测试方法。许多调试和编程工具都使用联合测试动作组(JTAG)接口端

参见IEEE Std 1149.1-1990 《IEEE标准测试访问端口和边界扫描体系结构规范》。

JTAG-AP

DAP的一个可选组件，提供对片上扫描链的调试器访问

JTAG-DP

DAP的可选外部接口，提供用于调试访问的标准JTAG接口

Little-Endian

在Arm架构的上下文中，little-endian被定义为内存组织，其中大部分是字的有效字节位于比最低有效字节更高的地址。

SWD

使用SOC和调试器之间的串行连接的调试实现。这个连接正常需要一个双向数据信号和一个单独的时钟信号，而不是JTAG所需的4到6个信号

连接。

SW-DP

串行线调试接口。

SWJ-DP

SWJ-DP是JTAG-DP和SW-DP的组合，您可以使用它们来连接串行线路调试(SWD)或者JTAG探测到目标芯片。

Flash-Tool

用于对目标芯片进行烧录写入的相关软件和硬件的统称

∴tip 提示

术语可通过百科或者WIKI 获取信息，本文档不一一列举。

∴

[下载本页PDF文件](#)

⋮